

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------------|---|
| <i>AES</i> | Augerelektronenspektroskopie |
| <i>EELS</i> | Elektronenenergieverlustspektroskopie (<i>electron energy loss spectroscopy</i>) |
| <i>FFT</i> | Schnelle Fourier-Transformation (<i>fast Fourier transformation</i>) |
| <i>FTIR</i> | Fouriertransform-Infrarot (-Spektrometer) |
| <i>HREELS</i> | Hochauflösende <i>EELS</i> (<i>high resolution EELS</i>) |
| <i>IR</i> | Infrarot |
| <i>IRAS</i> | Infrarot Reflexions-Absorptions Spektroskopie |
| <i>LEED</i> | Niederenergetische Elektronenbeugung (<i>low energy electron diffraction</i>) |
| <i>LH</i> | Langmuir-Hinshelwood-Reaktionsmechanismus |
| <i>MC</i> | Monte-Carlo Simulation |
| <i>MCT</i> | Quecksilber Cadmium Tellurit (<i>mercury cadmium tellurite</i>) |
| <i>MCV</i> | Monte Carlo-Versuch |
| <i>MF</i> | mittleres Feld Simulation |
| <i>MIR</i> | mittleres Infrarot |
| <i>ML</i> | Monolage |
| <i>MSSR</i> | Oberflächenauswahlregel für Metalle (<i>metal surface selection rule</i>) |
| <i>PEEM</i> | Photoemissions-Elektronenmikroskopie |
| <i>SPA-LEED</i> | Reflexprofilanalyse bei <i>LEED</i> (<i>spot profile analysis LEED</i>) |
| <i>STM</i> | Rastertunnelmikroskopie (<i>scanning tunneling microscopy</i>) |
| <i>TEM</i> | Transmission-Elektronenmikroskopie |
| <i>TDS</i> | Thermodesorptionsspektroskopie |
| <i>TOF</i> | Umwandlungsfrequenz (<i>turnover frequency</i>) |
| <i>TPD</i> | temperaturprogrammierte Desorption (<i>temperature programmed desorption</i>) |
| <i>TR-IRAS</i> | zeitaufgelöste <i>IRAS</i> (<i>time resolved IRAS</i>) |
| <i>TTL</i> | Transistor-Transistor Logik |
| <i>UHV</i> | Ultrahochvakuum |
| <i>UPS</i> | Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie |
| <i>XPS</i> | Röntgenphotoelektronenspektroskopie (<i>X-ray photoelectron spectroscopy</i>) |